镍片焊接不良失效分析

美信检测失效分析实验室

摘要:

本文通过对己脱落的 PCB (PAD)表面、脱落的镍片表面、未使用的 PCB (PAD)、镍片未脱落的焊点进行表面 SEM 观察、焊点剖面分析、EDS 分析等查找并分析形成镍片脱落的原因。OK 焊点中焊锡与镍片之间的 IMC 层发现较多孔洞、分层现象,且 IMC 层厚度不均匀,存在过厚和过薄现象,导致焊接强度降低,出现镍片易剥离现象。

关键词:

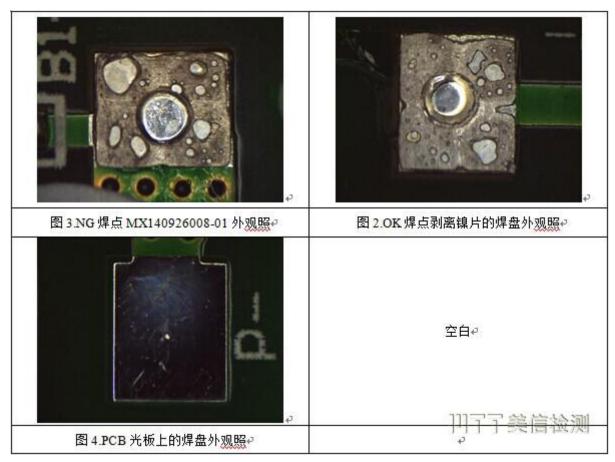
PCB, 焊点强度, IMC 粗大不均匀, 孔洞, 分层, 润湿性

1. 案例背景

客户反映,镍片通过回流焊接后,出现使用小于 12N 的力就可以从 PCB 焊盘上将镍片剥离现象,制造工艺要求镍片剥离强度要大于 15N。

2. 分析方法简述

A、样品外观照片:



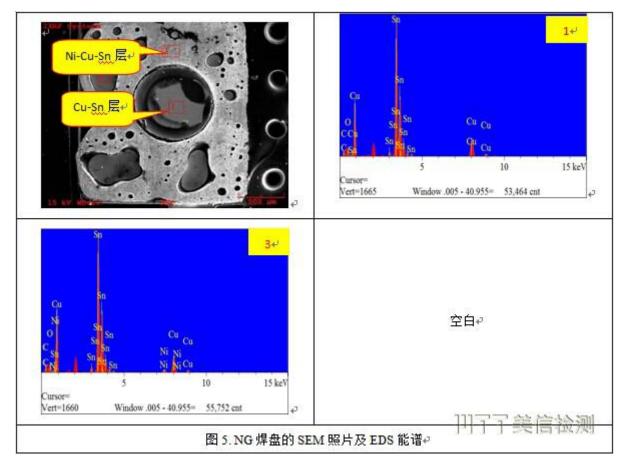
B、OK 焊点镍片的最大剥离力测试

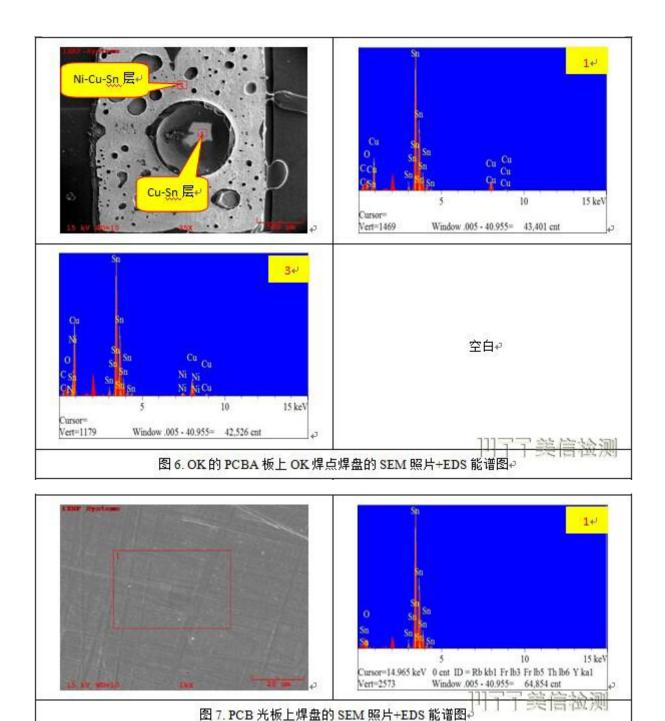
表 1.OK 焊点镍片剥离最大力

测试	测试结果(N)₽			
	1₽	26.4₽		
OV III E	24	25.2₽		
OK焊点₽	3₽	29.6+		
	平均值₽	月月] 景極测		

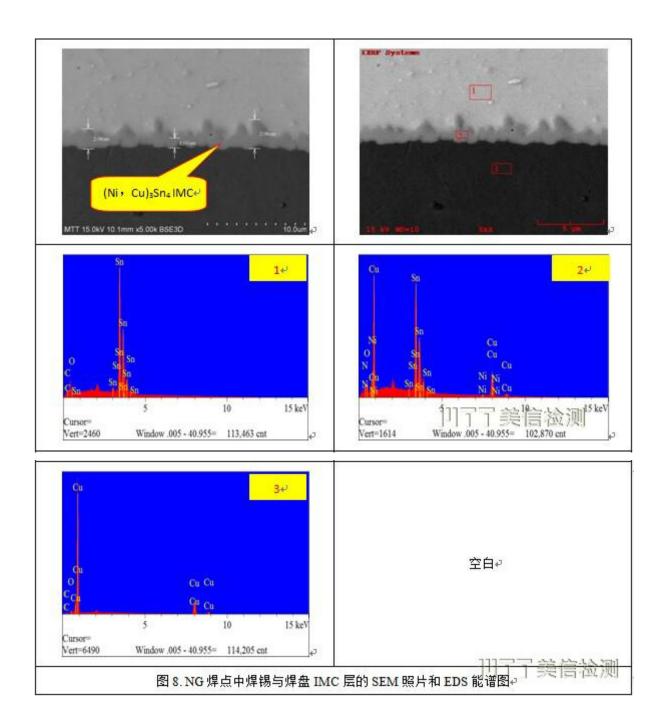
经过测试,OK 焊点的最大剥离力均大于15N。

- C、确定了试验方案后我们针对失效样品做了如下分析:
- 1、NG 焊盘表面、OK 焊盘表面、PCB 光板表面的 SEM 观察及 EDS 成分分析





2、NG 焊点与 OK 焊点的切片分析



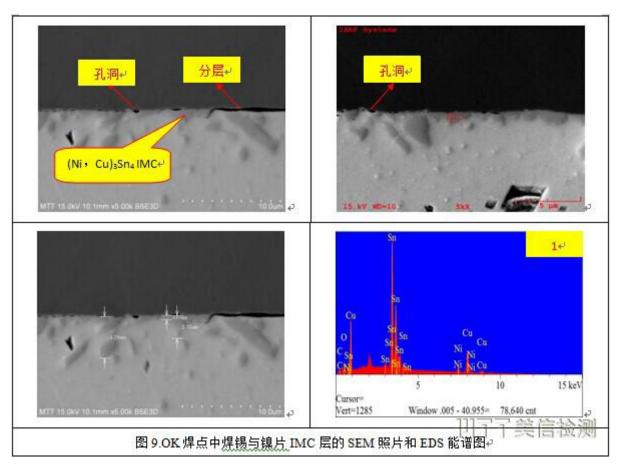


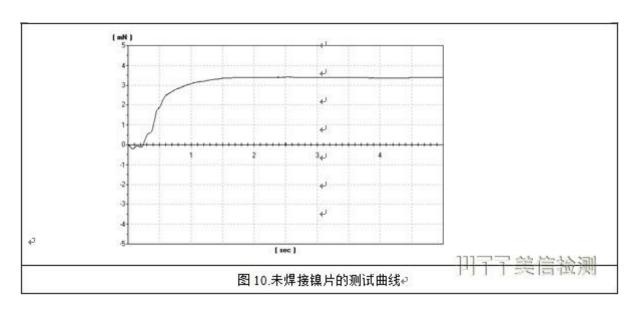
表 2.OK 焊点中焊锡与镍片 IMC 层厚度(um)

样品₽	测试点 1₽	测试点 2↩	测试点 3₽	平均值₽	
OK焊点₽	4.25₽	0.44₽	2.32₽	2.34₽	

D、同批次未焊接镍片的可焊性验证

表 3.同批次未焊接镍片的测试数据

样品项目	T0(s)+	T1(s)₽	T2/3(s)+	2/3Fmax (mN)↔	Emax (mN)₽	Fend (mN)↔	Spo	F2(<u>mN</u>)₽	F5(mN)
MX140926 008-08₽						×	0.99₽	3.394	3.38₽



3. 结论

可能是由于镍片的润湿速度较快,回流焊的 TOL 时间过长,导致焊点 IMC 结构粗大、松散,且存在孔洞和分层现象,导致焊接强度偏低,严重的将导致镍片在小于 12N 的力下剥离,出现失效情况。

4. 参考标准

GJB 548B-2005 微电子器件失效分析程序-方法 5003

GB/T16491-2008 电子式万能试验机

IPC-TM-650 2.1.1-2004 手动微切片法

GB/T 17359-2012 微束分析能谱法定量分析

GB/T 27788-2011 微束分析扫描电镜图像放大倍率校准导则

J-STD-002C 元器件引线、端子、焊片、接线柱和导线的可焊性测试

作者简介:

MTT (美信检测) 是一家从事材料及零部件品质检验、鉴定、认证及失效分析服务的第三方实验室, 网址: www. mttlab. com, 联系电话: 400-850-4050。